

計測分析に関する講演会 「金属・セラミックス材料の組成分析」

～成分とその分布～

開催のご案内

主催:あいち産業科学技術総合センター

共催:(公財)科学技術交流財団

あいち産業科学技術総合センターでは、種々の高度分析機器を用いた分析・評価により、企業の方々の新技術・新製品開発への取組みや現場の課題解決を支援しています。

このたび、ご相談の多い新製品開発や、異物の分析に際しての「金属・セラミックス材料の組成分析」に焦点をあてた講演会を、平成27年1月30日(金)に開催します。講演会では、走査電子顕微鏡(SEM)を用いた材料の組成分布や、ICP発光分析装置(ICP-AES)・蛍光X線分析装置(EDS)による主成分・微量成分の分析について、様々な事例をご紹介します。

講演後は、計測分析に関する個別の技術相談会や、当センターの計測分析機器及び隣接するあいちシンクロトロン光センターの見学会を行います。

参加費は無料です。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

【日時】平成27年1月30日(金) 午後1時30分～午後4時45分

【場所】あいち産業科学技術総合センター 1階 講習会室

愛知県豊田市八草町秋合 1267-1 TEL: 0561-76-8315

東部丘陵線リニモ「陶磁資料館南」駅 下車すぐ

※会場には公共交通機関を利用してお越しく下さい

【プログラム】

時間	内容
13:00 ~ 13:30	受付
13:30 ~ 13:40	開会あいさつ
13:40 ~ 14:40	「FE-SEMによる成分分析事例紹介」 講師:株式会社日立ハイテクノロジーズ 課長 <small>わたなべ としや</small> 渡邊 俊哉氏
14:50 ~ 15:50	「バルクの主成分と微量成分の分析について ～ICP発光分析装置及び蛍光X線(EDS)装置を用いた分析事例紹介～」 講師:株式会社日立ハイテクサイエンス 課長 <small>なみき けんじ</small> 並木 健二氏
16:00 ~ 16:15	「当センターにおけるICP-AESによる測定事例の紹介」 担当:あいち産業科学技術総合センター共同研究支援部 計測分析室 技師 <small>たなはし のぶひと</small> 棚橋 伸仁
16:15 ~ 16:45	技術相談会・見学会(希望者のみ) 当センターの計測分析機器、あいちシンクロトロン光センター

■ **申込方法** 下記の申込書にご記入の上、FAX、郵送または電子メールでお送りください。

■ **申込期限** 平成27年1月29日（木）

■ **参加費** 無料

■ **定員** 100名（先着順）

■ **交通のご案内**

- ・ 東部丘陵線リニモ「陶磁資料館南駅」下車、北側すぐ
- ・ 猿投グリーンロード八草 IC から西へ 約 800 m

■ **申込先及び問い合わせ先**

あいち産業科学技術総合センター

共同研究支援部計測分析室 杉本、棚橋、加藤

〒470-0356 豊田市八草町秋合1267-1

電話：0561-76-8315 FAX：0561-76-8317

メール：AIC0000001@chinokyoten.pref.aichi.jp

URL：<http://www.aichi-inst.jp/>



計測分析に関する講演会（1月30日（金））

参加申込書

平成 年 月 日

あいち産業科学技術総合センター 共同研究支援部計測分析室 杉本、棚橋、加藤 宛

FAX：0561-76-8317 メール：AIC0000001@chinokyoten.pref.aichi.jp

ふりがな				
企業名				
所在地	〒			
ふりがな				
所属・氏名				
連絡先	TEL FAX			
	メールアドレス			
相談・見学会への参加 両方参加も可 (ご希望に○をつけて下さい。)	<table style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td>相談会参加</td> <td>見学会参加</td> <td>不参加</td> </tr> </table>	相談会参加	見学会参加	不参加
相談会参加	見学会参加	不参加		

※ご記入いただいた個人情報は、セミナー情報の提供等、当センターからの各種連絡のために利用させていただくことがあります。
あらかじめご了承ください。

※参加受付証は発行いたしません。直接会場にお越し下さい。

「センターニュース」のメール配信を希望される方は、チェックしてください。